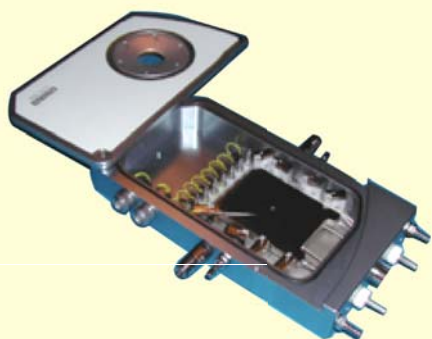


LTS420E-P



简介

探针台主要为电性测量而设计。针尖镀金的探针可以连接在热台腔室内部的电极上，针座可以移动，保证针尖可以接触到热台上的任何一个区域。探针压在样品上的力度可以通过弹簧调整。

两种型号的探针台可以选择。LTS420-P主要为半导体器件的电性测量而设计。选择冷却系统，温度可以低到-196°C。

参数

- 温度范围：-196°C到420°C（-196°C需选择专用冷却系统）
- 全程温度精度/稳定性：0.1°C/<0.1°C
- 光孔直径：φ2.4mm
- 样品区域面积：58x43mm
- 4个样品探针，2个LEMO接头（BNC接头可以提供）
- 加热速率：0.1-30°C/min
- 超薄热台窗口：0.17mm
- 台体尺寸- 169 x 110 x 25.8 mm
- 最小物镜/聚光镜工作距离：8.2/12.5mm
- 气密样品腔室,可充入保护性气体
- 滑动上盖易于样品导入
- 独立温度控制